

Model AE-365E 超高速·高精度·120Hz/1kHz 数字容量测试仪

最适合贴片、MELF、辐向和轴向式电容器包装机

特 征

- 超高速:1msec.【TYP】(测量时的时间)
- 通过 2pF/20pF 量程5V测定, 大幅提升微小容量的稳定度
- 通过测量值异常得知 2 端子(4 端子)测量时探测头接触不良的情况
- 4端子接触检测:可选择 测定后/OFF
- 测量频率:1kHz/120Hz±0.1%(正弦波)
- 可在串联等效电路、并联等效电路之间切换
- 定电压测量(适用部分量程)
- 可进行 tan δ测定(2pF 量程不适用)
- 31/2 位数(1999)数字显示、内置比较器功能可 HI/GO/LO 输出
- RS-232C 接口、打印机输出(适合 Centronics 的标准配备)(GP-IB 为选购)
- 间歇性增加测量电流以减轻量探测头接触磨损[120μF/1.2mF 量程]
- 即使在检测中也可打印测定值、统计值、日期、和时间



Model AE-365E 超高速・高精度・120Hz/1kHz 数字容量测试仪

SPECIFICATIONS

测量范围及基本精度度 (D<0.1 周围温度 23°C±5°C)

量程	测量范围	最小分辨率	精确度	测量电压	
2pF	0.000pF~1.999pF	0.001pF	±1.0% of rdg±5digit×α 以内	1kHz、1V±5%[rms]	1kHz、5V±5%[rms]
20pF	0.00pF~19.99pF	0.01pF	±0.25% of rdg±3digit×α 以内		----
200pF	0.0pF~199.9pF	0.1pF	±0.2% of rdg±2digit×α 以内		----
2nF	0.000nF~1.999nF	0.001nF	±0.2% of rdg±2digit 以内		----
20nF	0.00nF~19.99nF	0.01nF			----
200nF	0.0nF~199.9nF	0.1nF			----
2μF	0.000μF~1.999μF	0.001μF	±0.3% of rdg±3digit×α 以内	120Hz、0.5V±5%[rms]	
20μF	0.00μF~19.99μF	0.01μF			
120μF	0.0μF~119.9μF	0.1μF	±1.0% of rdg±5digit×α 以内	1kHz、1V+5%~-15%[rms]	----
200μF	0.0μF~199.9μF	0.1μF	±0.5% of rdg±3digit×α 以内	----	120Hz、0.5V±5%[rms]
1.2mF	0.000mF~1.199mF	0.001mF	±1.5% of rdg±5digit×α 以内	----	120Hz、0.5V+5%~-25%[rms]

※0.1<D<1的情况下、在上记精确度上加上 25D/100(%)。 α: FAST 時 2(2pF 量程/1 V 時 α=10) SLOW 時 1(2pF 量程/1 V 時 α=5)

测量方式	3/5 端子测量方式[可选择不同量程]
测量频率	120Hz/1kHz±0.1%、正弦波
测量讯号输出阻抗	约 1Ω
寄生电容修正范围	约 30pF
满刻度及零度系数	±100ppm/°C以内
测量时间	【空转周期】FAST: 约 1~5 次/秒 SLOW: FAST×N(N:平均值设定次数) 【测量中讯号[FAST]】1msec.[最快时]
比较器设定范围	Capacitance: HI/LO 和 1999[120μF/1.2mF 量程 HI/LO 与 1199] tan δ: 99.9%
周围使用环境	温度: 0°C~+50°C、湿度: 85%以下
所需电源	AC85V~265V、50~60Hz、约 50VA
外形尺寸	333(W)×99(H)×300(D)mm (不含底部橡胶部分。)
重量	约 4kg

AE-365E 本体	[RS-232C 标准配备]
GP-IB 选购	[若选购 GP-IB 则无法搭载 RS-232C]

○说明书的内容会因机台改良而随时变更,恕不另行通知。

AEMIC 株式会社

〒612-8448

京都市伏見区竹田東小屋ノ内町 34 番地

电话:+81-75-612-0710 FAX:+81-75-612-0750

E-Mail: sales@ae-mic.com

http://www.ae-mic.com